

セミコン・ジャパン 2010 のご案内

2010年11月吉日

お客様各位

日本電子材料株式会社
国内営業統括部長 福島秀憲

拝啓

貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

本年も例年同様、業界最大イベントであるセミコンジャパン 2010 に出展いたします。
多様化するウェハー・テストに向け、プロービングの技術革新(進化)をお客様と共に実現したいと考えております。
弊社が数年来掲げております「*Your Probing Partner*」を合言葉に、お客様に信頼され、期待に応えるべく大いなる創造力を確かな技術に結びつけていきます。

ご多忙のこととは存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 期間 2010年12月1日(水) ~ 3日(金)
2. 場所 幕張メッセ
3. ブース 6A-207
4. 出展品

【Memory】

■MC Series (MEMS型、メモリ同測対応・300mm Wafer一括対応)

【System on Chip】

■VT Series (垂直型、狭ピッチ・同測対応・4辺パッド配列・高温対応)

■VS Series (スプリングピン型、FC・はんだボール対応)

■CN Series (カンチレバー型、狭ピッチ・多マルチ対応)

【Image Sensor】

■VE Series (カンチレバー+垂直 複合型、多マルチ対応)

【TCC】

■Test Cell Conditioner Cleaning Chip (パッケージテスト用ソケット向けクリーニングシート オンライン対応)

Your Probing Partner